

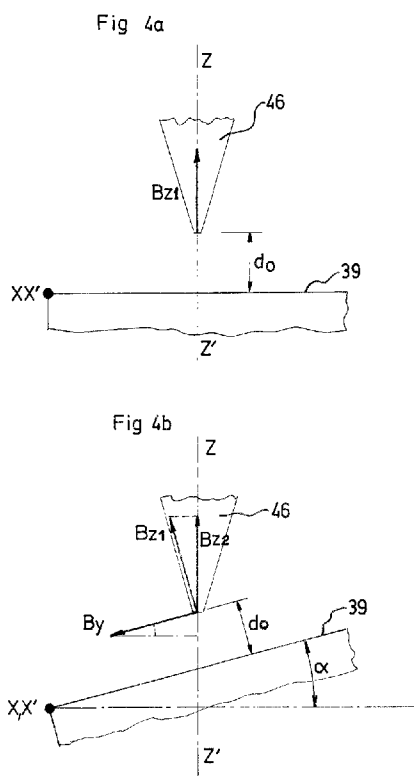


- (51) Classification internationale des brevets :
G01R 31/302 (2006.01) *G01R 31/265* (2006.01)
G01R 31/315 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2009/051204
- (22) Date de dépôt international :
24 juin 2009 (24.06.2009)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
08.03567 25 juin 2008 (25.06.2008) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (C.N.E.S.) [FR/FR]; 2 place Maurice Quentin, F-75039 Paris Cedex 01 (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **PERDU, Philippe** [FR/FR]; Résidence d'Enghien, Bâtiment A, 43 rue Corneille, F-31100 Toulouse (FR).
- (74) Mandataire : **CABINET BARRE LAFORGUE & ASSOCIÉS**; 95 rue des Amidonniers, F-31000 Toulouse (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD AND MACHINE FOR MULTIDIMENSIONAL TESTING OF AN ELECTRONIC DEVICE ON THE BASIS OF A MONODIRECTIONAL PROBE

(54) Titre : PROCÉDÉ ET MACHINE DE TEST MULTIDIMENSIONNEL D'UN DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE À PARTIR D'UNE SONDE MONODIRECTIONNELLE



(57) Abstract : The invention relates to a method and a machine for testing an electronic device, in which the magnetic field emitted is measured by a monodirectional measurement probe (46) characterized in that: - a first value (Bz1) of the component Bz of the magnetic field along the axis ZZ' is measured by the probe (46) and recorded, then the probe (46) and the electronic device are displaced with respect to one another by relative pivoting about an axis XX' orthogonal to the axis ZZ', according to an angular amplitude of less than 90° while being kept at the same distance d0 and, for each position (x, y) of the axis ZZ', a second value (Bz2) of the component Bz of the magnetic field along the axis ZZ' is measured by the probe (46) and recorded, then the value of a component By of the magnetic field along an axis YY' orthogonal to the axes ZZ' and XX' is determined and recorded on the basis of the first value (Bz1) and of the second value (Bz2) obtained.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé et une machine de test d'un dispositif électronique, dans lequel le champ magnétique émis est mesuré par une sonde (46) de mesure monodirectionnelle caractérisé en ce que : - une première valeur (Bz1) de la composante Bz du champ magnétique selon l'axe ZZ' est mesurée

[Suite sur la page suivante]



(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport (règle 48.2.g))

par la sonde (46) et enregistrée, puis la sonde (46) et le dispositif électronique sont déplacés l'un par rapport à l'autre par pivotement relatif autour d'un axe XX' orthogonal à l'axe ZZ' selon une amplitude angulaire inférieure à 90° en étant maintenus à la même distance dO et, pour chaque position (x, y) de l'axe ZZ', une deuxième valeur (Bz2) de la composante Bz du champ magnétique selon l'axe ZZ' est mesurée par la sonde (46) et enregistrée, puis la valeur d'une composante By du champ magnétique selon un axe YY' orthogonal aux axes ZZ' et XX' est déterminée et enregistrée à partir de la première valeur (Bz1) et de la deuxième valeur (Bz2) obtenues.